研究報告

令和 7 年 4 月 15 日

公益財団法人 前田記念工学振興財団

理事長岸利治殿

研究代表者

所 属 :名古屋工業大学

氏 名 :吉田 亮

研究課題名:コンクリート空隙におけるケイ酸ゲル生成メカニズムの解明と補修材開発 への展開

助成金額:100万円

研究実施期間:自 令和6年4月1日 ~ 至 令和7年3月31日

研究報告 令和6年度 土木分野 No.16

コンクリート空隙におけるケイ酸ゲル生成メカニズムの解明と補修材 開発への展開

Elucidation of the mechanism of silica gel formation in concrete voids and its application to the development of repair material

名古屋工業大学 准教授 吉田 亮

(研究計画ないし研究手法の概略)

コンクリート標準示方書の耐久性照査は、点検負担の大きい中性化を改め、水分浸透 に基づいた鉄筋腐食へと転換しつつある。この転換には、設計段階における水分浸透予 測式の整備に加え、既設構造物の水分浸透を抑制する補修材の開発が必要不可欠である。 ケイ酸塩系表面含浸材(補修材)に関する申請者の研究では、従来の工程を省略したと ころ、本来期待できない高い水分浸透抵抗性が確認された(特願 2020-190615)。この結 果からは、コンクリート空隙中においてケイ酸の凝集体(ゲル)が生成し、ケイ酸ゲル の吸水膨潤により空隙が閉塞したことで、水分浸透抑制につながったというの本課題に おける仮説を得た。

本申請課題では、空隙におけるケイ酸ゲルの生成メカニズムを検証することで、鉄筋 腐食をもたらす雨水や海水の浸透を、コンクリートの空隙に生成させたケイ酸ゲルの膨 潤作用によって止めるという、これまでに無い補修コンセプトを創出する。そして、ケ イ酸のゲル化メカニズムを利用し、劣化因子である CO₂、塩化物イオン、酸の侵入により 空隙を閉塞する補修材開発への展開を目指す。

(実験調査によって得られた新しい知見)

劣化因子との接触によるケイ酸ゲル 生成メカニズム

コロイダルシリカ(CS)は、液体溶媒中 に1~100 nmのシリカ粒子が安定して分散 している。シリカ粒子はSiO4の四面体を基 本単位として構成されるため、表面には酸 素原子が出ている。そのため粒子の表面電 位は負に偏り、周囲の粒子と静電的な反発 をすることで分散した状態を保つ。

一方で、このコロイド溶液中の安定状態 も、pHの変化で電荷のバランスが崩れる こと、電解質の影響により電気二重層が薄 くなり斥力が増加することを要因とし、シ リカ粒子が凝集し、ゲル化に転じる。図1 に示すように、本研究で使用した CS 溶液 では、シリカ粒子間に、van der Waals 力に よる引力と電気二重層による静電的な斥 力の2つの力が働いている。この引力と斥



力の大小関係により、シリカ粒子の分散安定性を評価(DLVO 理論) することができる。

上記の研究では、CS に塩酸を混合し pH が 6.8 まで低下すると CS が凝集することを示しており、このメカニズムに基づけば、鉄筋コンクリートの劣化因子である CO₂、酸性雨によっても CS のゲル化が起きると考えられる。

CO₂の溶解、酸性雨の混合も、CS 溶液中の H⁺を増やすため pH が低下する。そして pH 低下により CS 粒子回りのゼータ電位が低下することで、粒子間に働く斥力が小さくなり、CS のゲル化が引き起こされる。

また、鉄筋腐食の因子である NaCl 水溶液と CS の混合では、溶液中の電解質(Na⁺)が増 えることで、CS 粒子回りの電気二重層が薄くなる。そのため CS 粒子間の距離が縮み、van der Waals 力による影響が大きくなることで、CS のゲル化が起きる。

2. 劣化因子のとの接触によるケイ酸ゲルの生成検証

2.1 CO₂によるケイ酸ゲルの生成

図1に CS と Ca(OH)2 飽和溶液の CO2によ る中性化の様子を示す。各時間の写真におけ る左の試験管が CS、右の試験管が Ca(OH)2 溶 液である。フェノールフタレイン溶液で赤紫 に呈色した CS と Ca(OH)2 溶液は、封入した CO2 により液面から中性化が進行し、白濁ま たは無色透明となった。

図2にCSとCa(OH)2 溶液の中性化深さの 時間変化を示す。CO2を封入して300分間後で は、Ca(OH)2 溶液の中性化深さは48 mm であ ったが、CSの中性化深さは4.5 mm であり、CS の中性化の進行は、Ca(OH)2 溶液の1/10 未満の 深さとなった。

この理由には、pH 低下により形成されたケイ 酸ゲルが、その後の CO₂の侵入・溶解を抑制した ことが考えられる。ケイ酸ゲルは3次元の網目構 造を持ち、そのネットワークの間隙に水分を抱え 込んでいる。このような状態の水のなかに CO₂が 溶け込み、拡散していくのは時間がかかることが 想像できる。

2.2 NaCl水溶液によるケイ酸ゲルの生成

図3に CS と NaCl 水溶の混合直後(図の上段)と48時間静置後(図の下段)のガラス瓶内の様子をそれぞれ示す。混合直後の白濁の様子



図 2 CO₂ 侵入により生成されたケイ酸ゲル による中性化抑制



図 3 NaCI 溶液を混合した CS のゲル化の 様子(数字は NaCI 濃度、上段は混合直 後、下段は混合より 48 時間後)

からは、塩分濃度 3.25~3.5 wt%の範囲において CS が凝集し始める臨界濃度が存在するようにみえる。しかし、混合 48 時間後のときには、すべての塩分濃度において CS が凝集することが観察され、塩分濃度が大きいほどシリカ粒子の凝集が開始するまでの時間が短いことが予想された。

上記の考えを検証するため、図4に、CSに各塩分濃度のNaCl水溶液を混合したときの粒

子径の経時変化を示す。塩分濃度が 3.45 wt% では、混合して 55 分間後に粒子径が大きく なりはじめ、CS が凝集していることがわか る。一方で、塩分濃度 3.25 wt%では、混合し て 90 分間後に粒子径が大きくなり CS が凝 集している。塩分濃度によって凝集時間に 違いが生じることは、溶液中の電解質濃度 を原因とする。NaCl 水溶液の濃度が高いほ ど、電解質濃度も高く、CS 粒子の電気二重 層が圧縮されることで、粒子間距離が小さ くなり、van der Waals 力による影響が大き くなるため、CS が凝集しやすい状態にな る。

2.3 模擬酸性雨によるケイ酸ゲルの 生成

図 5 に、CS と模擬酸性雨を混合した溶 液の粒子径とゼータ電位の測定結果を示 す。粒子径は、pH=9~6.5 において約 20~ 30 nm で、pH=6.2 以下では約 180~250 nm となった。ゼータ電位は、pH の低下ととも に0に近づき、粒子径が増大する pH=6.2 ~6.5 では、ゼータ電位も、凝集の目安と される-30 mV より小さくなっており、ゼ ータ電位からも酸性雨混入による CS 凝集 の根拠が得られた。

空隙中に生成したケイ酸ゲルの存 在検証

図6に低温 DSC により測定をした、セ メントペースト硬化体の水分浸透状況を 示す。ここでは、CS 溶液を塗布した後に CO2にさらした試料と、CS 塗布後に NaCl 水溶液に浸漬させた試料、ならびに何も施 工していない試料の比較を行っている。

本研究では、DSC 測定の前に、試料は大 気圧下で 24 時間の吸水を行った。従って、 24 時間の吸水により、液状水が浸透した 空隙またはゲルの所在が、DSC の結果か ら読み取れるということである。

本実験で観察されたピークは-30℃から



図 4 NaCl 濃度と CS ゲル化までの時間:高 濃度であるほど CS ゲル化に要する時間は短 くなる。



図 5 pH 変化によるケイ酸ゲルの生成 (模擬酸 性雨を CS へ滴下した際の粒子径とゼータ電 位)



図 6 劣化因子が侵入した空隙中におけるケ イ酸ゲル生成の確認(低温 DSC)

-10℃の温度領域と、-40℃付近の2つが挙げられる。前者の高い方の温度領域では、いずれの試料においても大きな熱量が確認できる。無施工の試料を基準にすると、NaClに浸漬させ

た試料では、電解質の影響もあり、凍結 温度が低くなっている。一方で、CO₂にさ らした試料では、凍結温度が高くなって いるものの、凍結水量が少なくなってい ることがわかる。水溶液でなく CO₂でゲ ル化したことで、三次元網目構造に取り 込んだ水が少ない、密なゲルが空隙中に 存在すると考えられる。

また、図7に-40℃付近のピークを拡大 して示す。同図では、無施工の試料での みピークが観察された。このピークは、 上記した空隙よりも小さな空隙への水分 浸透を表しており、ゲルが生成している と考えられる NaCl または CO₂にさらし た試料では、このピークが確認されてい ない。

この結果からは、NaCl または CO₂にさ らした試料では、前者の大きな空隙にお いて、ゲルが生成されることで、DSC 測 定前に行った 24 時間の浸漬において、ケ イ酸ゲルが吸水膨潤することで空隙を閉 塞させて、後者の小さな空隙への水分浸 透が抑制されたと考えられる。

4. CO₂により生成させたケイ酸ゲルに よるモルタル硬化体の水分浸透 抵抗性

図8に、CO2によりゲルを生成させた



図 7 劣化因子が侵入した空隙中におけるケ イ酸ゲル生成の確認(図 6 の拡大)





モルタル硬化体の水分浸透深さの経時変化を示す。CS 塗布も促進中性化も施さなかった供 試体(図中N)では、24時間で水分が供試体サイズの40mmまで浸透した。CS塗布(図中 CS)、促進中性化を施した供試体(図中AC)では、浸漬24時間で25mm程度の浸透、CS塗 布の供試体は48時間までに34mm程度の浸透が確認された。CS塗布後に促進中性化を施 し、ケイ酸ゲルが生成していると考えられる供試体(図中CS-AC)では、浸漬24時間で9 mm程度、48時間で12mm程度の浸透深さとなった。供試体サイズの制限から、24時間の 浸透深さを比較すると、Nを基準とし、CSとACはおよそ37%の低減、CS-ACでは77%ま で低減している。

図1の試験管におけるケイ酸ゲル生成の実験結果では、CO2の侵入で生成したケイ酸ゲル が、その後のCO2の侵入を抑止していた。そして、本項の促進中性化試験でもCSを塗布し た供試体の中性化深さが3mmと小さいことを併せて考慮すると、CO2侵入により空隙に生 成されたケイ酸ゲルは、中性化の進行、そして降雨による水分浸透を抑制する可能性がある。

(発表論文)

吉田亮,近藤政晴,藤正督,劣化因子の侵入により空隙中にケイ酸ゲルを生成させる水分浸透抑制工法の提案,セメント・コンクリート論文集,社団法人セメント協会, Vol.78, pp. 365-371,2025.3.31